科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 28年 6月10日現在

機関番号: 82626
研究種目: 若手研究(B)
研究期間: 2013~2015
課題番号: 2 5 8 2 0 3 6 1
研究課題名(和文)水素吸蔵合金の耐久性向上を目指した水素吸蔵放出に伴う空孔形成回復メカニズムの解明
研究課題名(英文)Vacancy formation and recovery phenomena during hydrogenation and dehydrogenation in La(Ni,Cu)5+x
研究代表者
榊 浩司(SAKAKI, Kouji)
国立研究開発法人産業技術総合研究所・創エネルギー研究部門・主任研究員
研究者番号:2 0 3 9 2 6 1 5
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,300,000円

研究成果の概要(和文):本研究では、La(Ni,Cu)5+xの化学組成を変化させることで、格子のミスフィットの大きさや ダンベルペアの濃度を変化させ、空孔形成・回復に及ぼす影響を調べた。陽電子消滅実験の結果、すべての試料におい て格子欠陥形成に起因した陽電子寿命値の増加が見られた。しかし、化学組成のずれの増加とともに陽電子寿命値の上 昇が抑制され、蓄積される欠陥量が低減した。線回折実験の結果も踏まえると、化学組成をずらしたことで、格子の ミスフィットが減少し、形成される格子欠陥量が減少したこと、また、ダンベルペアの濃度が増えたことに伴い回復す る格子欠陥量が増大したことを示唆する結果が得られた。

研究成果の概要(英文): The vacancy formation and recovery phenomena during hydrogenation and dehydrogenation in La(Ni,Cu)5+x were investigated. The positron lifetime increased upon hydrogenation and dehydrogenation in all samples which we synthesized. However, its increment was suppressed with increasing of the deviation from the stoichiometry. X-ray diffraction results showed that the lattice misfit decreased and concentration of dumbbell pairs increased with increasing of the deviation from the stoichiometry. Therefore, it suggests that the vacancy formation was suppressed by smaller lattice misfit and/or the vacancy recovery was enhanced by increase of concentration of dumbbell pairs.

研究分野: 水素吸蔵材料

キーワード: 水素吸蔵 相変態 空孔

1.研究開始当初の背景

水素吸蔵合金は、エネルギー貯蔵媒体とし て注目されている。水素吸蔵合金の高い体積 水素密度を活かして、近年は燃料電池自動車 への適応も期待されている。しかしながら、 繰り返し耐久性の向上が課題の一つである。 一般的に水素吸蔵合金は、合金相から水素化 物相への相変態を伴い水素を吸蔵する。また、 水素化物は合金相に比べて 20%程度体積が膨 張するため、これら二相が共存する領域では 格子のミスフィットが生じる。そして、この 体積変化に起因し、転位および空孔が形成さ れることが報告されている。さらに、耐久性 が良好な材料には蓄積される格子欠陥が少 ないことから、耐久性を向上させる方策とし て、格子欠陥を低減させることが考えられる。

Pd-Ag 合金では相変態を伴い水素を吸蔵さ せると空孔や転位が形成される。しかしなが ら、同一合金でも水素吸蔵温度を変え、相変 態させずに水素を吸蔵させると格子欠陥の 形成が確認されていない。一方、水素吸蔵で 相変態しない LaNi₅Cu では、水素濃度が 0.5 H/M を超えると空孔が形成されはじめた。こ のことは、空孔形成は相変態に伴う格子のミ スフィットだけでは説明がつかず、体積膨張 等も関与していることを意味している。また、 LaNi₅Cu では、水素吸蔵で形成された空孔が 水素放出に伴い室温でも回復するという新 たな現象を発見した。

以上のような状況から、水素吸蔵・放出に 伴う格子欠陥の形成・回復挙動には不明な点 も多く、耐久性向上の観点からメカニズムの 解明が求められている。

2.研究の目的

水素吸蔵合金は耐久性に課題がある。その 原因として、水素吸蔵に伴う空孔や転位の蓄 積であると考えられている。そのため、解決 策として、これらの形成を抑制する、または、 蓄積させない(回復させる)ことが考えられ る。La(Ni,Cu)_{5+x}では水素吸蔵・放出時の相 変態に伴う格子のミスフィットや体積膨張 が空孔形成に寄与する可能性、化学組成のず れにより導入される特殊な構造欠陥(ダンベ ルペア)に起因した結晶格子内の過剰な原 た。そのため、本研究では、La(Ni,Cu)_{5+x}の 化学組成を変化させることで、格子のミスフ ィットの大きさ、体積膨張量やダンベルペア の濃度を制御し、これらが空孔形成・回復に



Fig.1 溶解後の一部の合金の RD パターン

及ぼす影響を詳細に調べる。

3.研究の方法

LaNi_{4+x}Cu、LaNi_{3+x}Cu₂、LaNi_{2+x}Cu₃ および LaNi_{5.4}合金をアーク溶解にて溶製した。溶解 後の合金は均質化のため、真空中、1323 K で 1 週間の均質化焼鈍を行った。溶解後の試料 について大気中での 線回折測定により試 料の同定を行った。得られた合金について 様々な温度において圧力組成等温線を測定 した。水素放出過程におけるその場観察線 回折実験は Rigaku TTR-3 を用いて行った。 また、一部の合金については、水素吸蔵過程 におけるその場観察放射光 線全散乱実験 (Spring-8、BL22XU)を行った。二体分布関数 は PDFgetX2 を用いて放射光 X 線回折データ から得た。二体分布関数の解析には PDFgui を、X 線回折データのリートベルト解析には RIETAN-2000 を用いた。水素吸蔵・放出にお ける格子欠陥の形成・回復挙動を調べるため に、陽電子消滅実験を行った。

4.研究成果

均質化焼鈍後の合金の 線回折パターン の拡大図を Fig.1 に示す。リートベルト解析 の結果、LaNi5.4を除くすべての合金で単相で あることを確認した。合金相の結晶構造は空 間群 No.191 の P6/mmm であった。LaNi₅₄では 主相のほかに、FCC 構造の Ni 相が析出した。 LaNi₅₄中の Ni 相の相分率は約 5%であった。 この結果は、LaNi₅の単相領域の組成幅が Cu 置換により広がったことを示している。 Fig.2にLaNi₄₊Cuの格子定数の化学組成依存 性を示す。a 軸の格子定数は化学組成のずれ とともに減少し、c軸の格子定数は増加した。 同様の挙動が LaNi_{3+x}Cu₂ でも確認できた。こ のことは LaNi, からの化学組成のずれを構造 空孔やアンチサイトアトムで緩和するので はなく、(Ni,Cu)のダンベルペアによるLaサ イトへの置換が起こっていることを示して いる。また、化学組成のずれとともに単調に 変化していることからダンベルペアの濃度 も化学組成のずれとともに増加したことを 示している。リートベルト解析の結果でも、 少なくとも LaNi_{4+x}Cu の場合、LaNi₄₋₄Cu まで は単調にダンベルペア濃度が増大すること を確認した。

次に得られた合金の水素吸蔵特性を評価 した結果を示す。Fig.3 には代表例として、 LaNi_{5.4} および LaNi_{4+x}Cu の結果を示す。LaNi_{5.4} の圧力組成等温線では仕込み組成が LaNi₅ か ら大きくずれているが、LaNi₅ と同様に平坦な



Fig.2 LaNi_{4+x}Cuの格子定数の組成依存性

プラトーが見られた。また、比較的大きなヒ ステリシスが見られた。このことは化学組成 のずれを Ni の析出により補っているため、 得られた水素吸蔵特性は LaNi。相に起因して いるためと考えられる。LaNi4+xCuの圧力組成 等温線では化学組成のずれの小さな LaNi₄ Cu においてもすでにヒステリシスが ほぼ消滅した。プラトーの平坦性は化学組成 のずれの大きさとともに悪くなり、傾斜が大 きくなった。また、水素の固溶限が徐々に広 がり、プラトーの幅が狭くなる傾向が観られ た。LaNi₄ 。Cu や LaNi 、Cu ではプラトーの傾斜 がかなり大きく、水素吸蔵・放出過程におい て相変態を経ずに水素を吸蔵していること を示唆している。LaNi_{3+x}Cu₂においても LaNi₄₄Cuと類似の傾向がみられた。すなわち、 化学組成をずらすことで、プラトー幅を変化 させ、相変態時の体積変化を制御した合金群 を作製することができた。しかしながら、今 回の実験で作製した合金の組成範囲および 測定温度条件においては、測定温度を制御す ることで相変態挙動を制御できる組成を見 出すことはできなかった。

LaNi_{4.4}Cu および LaNi_{4.6}Cu の水素吸蔵過程 について放射光 線全散乱実験を行った結 果をFig.4 に示す。真空排気時はFig.1 で示 したように、P6/mmm構造の単相であった。ど ちらの合金の回折パターンも水素圧力の増 加とともに低角度側に連続的にシフトし、新 たな回折ピークは出現しなかった。すなわち、 これらの合金では相変態を生じずに水素吸 蔵反応が進行したことになる。LaNi_{4.6}Cu では 格子定数が、a=5.008 および c=4.030 か ら a=5.251 および c=4.163 まで連続的



Fig.3 LaNi_{5.4}および LaNi_{4+x}Cu の圧力組成等温

に変化し、a 軸および c 軸の膨張率はそれぞ れ 4.9%および 3.3%であった。Fig.5 には Fig.4 で得られた回折パターンをフーリエ変 換することで得られる二体分布関数の変化 を示す。Fig.5 からわかるように、水素吸蔵 前の二体分布関数はリートベルト解析から 得られた平均構造モデルで説明ができた。す なわち、平均構造と局所構造に差が無いこと を示している。水素圧力の増加とともに相関 距離の長い方向に二体分布関数のピークが シフトし、二体分布関数の形状にも変化が見 られた。0.9 MPa 以上の水素圧力で完全に水 素を吸蔵した際、図中の矢印で示したピーク で平均構造モデルとのずれを示すようにな った。このことは水素を完全に吸蔵した際に は、局所的に格子がひずんでいることを示唆 している。しかしながら、水素放出後は平均 構造モデルで説明がつくことから、局所的な 格子のひずみは水素の占有によって生じた ものであり、水素の吸蔵・放出に伴い可逆的 に変化するものであることが明らかとなっ た。水素吸蔵に伴う平均構造からのずれの起 源については、空孔の可逆的な形成・回復と も関連している可能性があるため、今後詳細 に調べる予定である。

LaNi_{4+x}Cu および LaNi_{3+x}Cu₂の水素放出過程 におけるその場観察 線回折測定を行った。 LaNi_{4+x}Cu で得られた結果を Fig.6 に示す。 LaNi_{4+x}Cu でよび LaNi₄₋₂Cu ではそれぞれ 0.21 MPa および 0.28 MPa 付近で高角度側に明瞭な 2 相共存を示す新たな回折ピークが出現した。 水素圧力の減少とともに、この新たな回折ピ ークの強度が増加し、水素化物のピーク強度 が最終的には消滅した。すなわち、これらの 合金では相変態を生じながら、水素放出が起



Fig.4 LaNi_{4.4}Cu および LaNi_{4.6}Cu の水素吸蔵過







こっていることになる。一方、LaNi₄ Qu およ び LaNi4.6Cu では水素圧力の減少とともに連 続的に回折ピークが高角度側にシフトする 傾向が観られた。ただし、それぞれの合金で、 0.428 MPa および 0.495 MPa 付近で単相では 説明のつかない回折パターンが得られた。こ のプロファイルは格子のミスフィットがか なり小さな2相共存領域となっていると考え ている。ただし、現時点では単純に P6/mmm の空間群の合金相と水素化物相を仮定し、リ ートベルト解析を行っても、うまくプロファ イルを説明できていない。今回の結果から、 LaNi₄ Cu および LaNi₄ Cu では水素吸蔵過程 と放出過程で相変化挙動に違いが見られた ことになる。また、すべての合金に対するリ ートベルト解析の結果、c 軸方向に対する格 子膨張量は化学組成のずれにあまり影響さ れなかったが、a軸方向は比較的抑制され、2 相共存領域での2相の格子定数の差も小さく なることを確認した。

最後に、水素吸蔵・放出後の試料について 陽電子寿命測定を行った結果を示す。Fig.7 に示すように、LaNi_{4+x}Cu および LaNi_{3+x}Cu₂の 熱処理後(水素吸蔵前)の陽電子寿命値は、そ れぞれ 125~128 ps および 127~131 ps であ った。このことは LaNi₅系合金の完全結晶の 陽電子寿命値に近い値であり、 ²/q の値も ほぼ1であるため、熱処理によって陽電子が 検出できるすべての格子欠陥を除去できて いることを示している。また、完全結晶の陽 電子寿命値に対して、ダンベルペアの濃度は ほとんど影響を与えなかった。水素吸蔵・放 出後の陽電子寿命値は、すべての試料におい て水素吸蔵前と比べて 40 ps 以上も上昇した。 このことは水素吸蔵・放出によって格子欠陥 が導入されたことを意味している。LaNi₅系合 金の転位の寿命値は約 150 ps であることか ら、空孔も導入され、水素放出後に蓄積して



Fig.6 LaNi_{4+x}Cu の水素放出過程における 線

いることを示している。しかしながら、 LaNi44,Cu および LaNi34,Cu2のどちらの場合に おいても水素放出後の陽電子寿命値は化学 組成のずれが大きくなるとともに短くなる 傾向が観られた。このことは、蓄積された格 子欠陥量が減少したことを示している。水素 放出過程におけるその場観察 線回折実験 で、格子のミスフィットの程度に違いがみら れたが、すべての試料において相変態が生じ ることを確認した。すなわち、陽電子寿命値 の上昇はこの相変態に起因していると考え られる。しかし、化学組成のずれとともに陽 電子寿命値が短くなっていることから、相変 態における格子のミスフィットが小さくな ることで、形成される格子欠陥量が減少した こと、また、ダンベルペアの濃度が増えたこ とに伴い回復する格子欠陥量が増大したこ とを示唆する結果が得られた。

5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

- 〔雑誌論文〕(計 0 件)
- [学会発表](計 0 件)
- 〔図書〕(計 0 件)
- 〔 産業財産権 〕 出願状況 (計 0 件)
- 取得状況(計 0 件)
- 6.研究組織
- (1)研究代表者
 - 榊 浩司 (SAKAKI, Kouji) 国立研究開発法人産業技術総合研究所創 エネルギー研究部門・主任研究員 研究者番号:20392615



Fig.7 LaNi_{4+x}Cu および LaNi_{3+x}Cu₂の陽電子寿命 測定結果

回折測定結果